

# Стилусный профилометр DP100B



## Цена:

Цена по запросу

#### Описание

Стилусный профилометр — это высокоточный измерительный прибор, предназначенный для анализа микрорельефа и структуры поверхности

различных материалов. Он используется для контактного измерения параметров поверхности с помощью тонкой иглы (стилуса), которая перемещается по образцу и фиксирует его профиль.

#### Основные задачи и применения

- Измерение параметров шероховатости (например, Ra, Rz, Rq) и микрорельефа поверхности.
- Определение высоты ступенек, глубины канавок, толщины пленок и покрытий.
- Анализ формы, прогиба, текстуры и равномерности покрытия поверхности.
- Выявление структурных дефектов и оценка качества обработки поверхности.
- Измерение внутренних напряжений в тонких пленках и слоях.
- Проведение 2D и 3D визуализации поверхности для научных и производственных задач.

### Преимущества стилусных профилометров

- Высокая точность и разрешение до 0,05 нм (по всему диапазону)
- Возможность анализа сложных поверхностей и тонких пленок без их повреждения (благодаря минимальному усилию зонда).
- Надежная повторяемость результатов и автоматизация измерений.

## Принцип работы

• Стилус (игла) с коническим наконечником опускается на поверхность образца и перемещается по ней, следуя ее рельефу. Вертикальные перемещения иглы регистрируются высокочувствительным датчиком, что позволяет строить точный профиль поверхности в 2D или 3D.

## Технические характеристики

| Корпус                    | Напольный, встроенная защита от вибраций           |
|---------------------------|--|
| Загрузка/выгрузка пластин | Ручная загрузка                                    |
| Размер пластин<br>Толщина | Макс. Ø200мм <b>(опционально Ø300мм)</b><br>≤10 мм |

| Размер стола  | Ø240 мм   |
|---|---|
| Высота ступени зонда Воспроизводимость измерений Вертикальное разрешение Диапазон усилия зонда Скорость выборки Направление сканирования Максимального количества | 80 мкм ≤ 0.5нм (1sigma на ступеньке 1 мкм) 0,05 нм (по всему диапазону) 0,5 ~ 50 мг 200 Гц Двунаправленное 2 миллиона точек |
| точек сканирования  |   |
|   | Горизонтальное направление (X/Y) и вращение (RZ)  |
| Режим движения стола для образцов   | Ход по X-Y 150x150мм, ход по Z 10мм<br>Вращение стола: ±360°  |
| Скорость сканирования по Z: Максимальная длина сканирования по X-Y  | Область сканирования по Z: 80мкм (разрешение 0.05 нм)   |
|   | 5 мкм/с ~ 50 мкм/с<br>55мм  |
| Характеристики зонда  | Радиус кривизны ≥2 мкм, угол 60° (другие спецификации опционально)  |
| Калибровочный образец   | высота ступеньки 1мкм   |

| Две камеры высокого разрешения Функции программного обеспечения | Наблюдение под углами 90° и 45° Измерение шага, шероховатости и других параметров рельефа поверхности, измерение напряжения   |
|---|---|
| Система управления  | ПК с комплектом ПО (OS Windows), монитор Язык ПО: английский Встроенные стандарты по ISO/ASME/EUR/GBT для 2D, 3D параметров Построение 2D, 3D изображений; линейные измерения |